

§5.5 (广义)似然比检验((Generalized) Likelihood Ratio Test)

一、广义似然比检验

设 $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim p(x; \theta)$ 的样本, 其中 $p(x; \theta)$ 为 pmf 或 pdf. 则似然函数为

$$L(\theta; \tilde{x}) = p(\tilde{x}; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta.$$

考察假设检验问题

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta_0^c. \quad (1)$$

Definition

定义5.5.1 令

$$\lambda(\tilde{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \tilde{x})}{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \tilde{x})} = \frac{L(\hat{\theta}; \tilde{x})}{L(\hat{\theta}_0; \tilde{x})},$$

其中

$$\hat{\theta}_0 = \arg \sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \tilde{x}), \quad \hat{\theta} = \arg \sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \tilde{x}).$$

称 $\lambda(\tilde{x})$ 为(广义)似然比((generalized) likelihood ratio), 而称 $\lambda(\tilde{X})$ 为检验问题(1)的(广义)似然比(检验)统计量. 拒绝域为 $\{\tilde{x} : \lambda(\tilde{x}) > C\}$ 的检验称为(广义)似然比检验((generalized) likelihood ratio test).

求临界值 C , 仍然根据Neyman-Pearson原则, 先要求满足

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}\{\lambda(\tilde{X}) > C\} \leq \alpha \quad \text{且尽可能接近}\alpha.$$

有时据此式不易求出 C , 但如果存在另一个统计量 $G = G(\tilde{X})$, 且 $\lambda(\tilde{X})$ 随 $G(\tilde{X})$ 上升而严格上升(或, 上升而严格下降), 而且 $G(\tilde{X})$ 的分布为我们所熟知或其分位数容易得到, 那么据 $G(\tilde{X})$ 可定出拒绝域:

$$D = \{\tilde{x} : G(\tilde{x}) > C'\} \quad (\text{或} \quad D = \{\tilde{x} : G(\tilde{x}) < C''\}),$$

其中 C' (或 C'')满足如下条件:

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}\{G(\tilde{X}) > C'\} \leq \alpha \quad \text{且尽可能接近}\alpha$$

$$(\text{或} \quad \sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}\{G(\tilde{X}) < C''\} \leq \alpha \quad \text{且尽可能接近}\alpha).$$

则基于 G 的拒绝域

$$D = \{\tilde{x} : G(\tilde{x}) > C'\} \quad (\text{或} \quad D = \{\tilde{x} : G(\tilde{x}) < C''\})$$

与 $\{\tilde{x} : \lambda(\tilde{x}) > C\}$ 等价, 这样构造的检验也是广义似然比检验.

Example

对正态分布族 $\{N(\mu, \sigma^2) : -\infty < \mu < \infty, \sigma > 0\}$. 检验

$$H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

求GLRT.

解: 设 $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 是抽取的样本, 则似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2; \tilde{x}) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}, \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

在参数空间

$$\Theta = \{(\mu, \sigma^2) : -\infty < \mu < \infty, \sigma > 0\}$$

上, μ 和 σ^2 的MLE为

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n = S_n^2;$$

从而

$$L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2; \tilde{X}) = (2\pi S_n^2)^{-n/2} e^{-n/2}.$$

而在

$$\Theta_0 = \{(\mu_0, \sigma^2) : \sigma > 0\}$$

上, $\mu = \mu_0$, σ^2 的MLE为

$$\hat{\sigma}_0^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 / n.$$

从而

$$L(\mu_0, \hat{\sigma}_0^2; \tilde{X}) = (2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{-n/2} e^{-n/2}.$$

所以

$$\begin{aligned}\lambda(\tilde{X}) &= \frac{L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2; \tilde{X})}{L(\mu_0, \hat{\sigma}_0^2; \tilde{X})} = (\hat{\sigma}_0^2 / \hat{\sigma}^2)^{n/2} = \left(1 + \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{S_n^2}\right)^{n/2} \\ &= \left\{1 + \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}}\right)^2 / (n-1)\right\}^{n/2} = (1 + t^2 / (n-1))^{n/2},\end{aligned}$$

其中 $t = t(\tilde{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}}$. 那么 $\lambda(\tilde{X})$ 是 $|t|$ 的严格单调上升函数, 所以 GLRT 等价于

当 $|t| > C'$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $|t| \leq C'$ 时, 接受 H_0 .

这也就是 t 检验, C' 取为 $t_{\alpha/2}(n-1)$.

二、分布的似然比检验

假设关于总体 X 的密度函数(或分布列) $p(x; \theta)$ 可提出如下两个假设:

$$H_0 : p(x; \theta) = p_0(x; \theta) \longleftrightarrow H_1 : p(x; \theta) = p_1(x; \theta).$$

为检验这两个假设中哪一个更合理, 从总体 X 中取样本 $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_n)$.

令

$$\lambda(\tilde{x}) = \frac{L_1(\hat{\theta}_1; \tilde{x})}{L_0(\hat{\theta}_0; \tilde{x})} = \frac{\prod_{i=1}^n p_1(x_i; \hat{\theta}_1)}{\prod_{i=1}^n p_0(x_i; \hat{\theta}_0)} = \frac{\sup_{\theta} \prod_{i=1}^n p_1(x_i; \theta)}{\sup_{\theta} \prod_{i=1}^n p_0(x_i; \theta)}.$$

取 $\lambda(\tilde{X})$ 为检验统计量.

当 $\lambda(\tilde{x}) > C$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $\lambda(\tilde{x}) \leq C$ 时, 接受 H_0 .

其中, C 满足

$$P(\lambda(\tilde{X}) > C | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha \text{ 且尽可能接近 } \alpha.$$

Example

考虑假设检验问题:

$$\begin{aligned}H_0: p(x; \mu, \sigma^2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \\H_1: p(x; \mu, \sigma^2) &= \frac{1}{\sigma} \exp \left\{ -\frac{x - \mu}{\sigma} \right\}, \quad x > \mu.\end{aligned}$$

解: 在 H_0 为真时, μ 和 σ^2 的MLE 为

$$\hat{\mu}_0 = \bar{X} \quad \text{和} \quad \hat{\sigma}_0^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n = S_n^2.$$

$$\sup L(\mu, \sigma^2; \tilde{x} | H_0) = L(\hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0^2; \tilde{x} | H_0) = (2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{-n/2} e^{-n/2}.$$

在 H_1 为真时, μ 和 σ 的MLE 为

$$\hat{\mu}_1 = X_{(1)} \quad \text{和} \quad \hat{\sigma}_1 = \sum_{i=1}^n (X_i - X_{(1)})/n.$$

$$\sup L(\mu, \sigma; \tilde{x}|H_1) = L(\hat{\mu}_1, \hat{\sigma}_1; \tilde{x}|H_1) = (\hat{\sigma}_1)^{-n} e^{-n}.$$

似然比统计量为

$$\lambda(\tilde{X}) = (2\pi/e)^{n/2} \cdot D^n.$$

其中

$$D = \frac{S_n}{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{(1)})/n}.$$

$\lambda(\tilde{X})$ 关于 D 严格增加, 所以区分正态分布与指数分布可取 D 为检验统计量.

令 $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$, 则

$$D = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 / n}}{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y_{(1)}) / n}.$$

在 H_0 为真时, Y_1, Y_2, \dots, Y_n i.i.d. $\sim N(0, 1)$.

在 H_1 为真时, Y_1, Y_2, \dots, Y_n i.i.d. $\sim E(1)$.

D 的分布与参数 μ, σ 无关.

取 D_α 使得

$$P\{D > D_\alpha | H_0\} = P\{D > D_\alpha | \text{总体分布为 } N(0, 1)\} = \alpha.$$

拒绝域为

$$\{\tilde{x} : d > D_\alpha\}.$$

D 的近似分布和 D_α 的近似值可由随机模拟方法求得.

D_α 的模拟法:

Step 1. 产生 n 个标准正态随机数 y_1, \dots, y_n , 代入 D 中, 计算 D 的观察值 d_1 ;

Step 2. 重复Step1 N 次, 得到 N 个 D 的观察值 d_1, \dots, d_N ;

Step 3. 取 d_1, \dots, d_N 的样本上侧 α 分位数 \hat{D}_α 作为 D_α 的近似.

此时

$$p - value = \frac{\#\{i : d_i > d(\tilde{x})\}}{N},$$

其中 $d(\tilde{x})$ 是将样本代入检验统计量 D 后所得的统计量的值.

三、大样本似然比检验

为构造水平为 α 的似然比检验, 我们要求临界值 C 使得

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta} \{ \lambda(\tilde{X}) > C \} \leq \alpha.$$

这就需要知道似然比检验统计量 $\lambda(\tilde{X})$ 的分布. 在应用中, 它的精确分布往往比较复杂, 甚至难以计算得到它的精确分布.

Theorem

(*LRT*的渐近分布, 简单原假设情形) 考察假设检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

设 $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 是从总体 $p(x; \theta)$ 抽取的 *i.i.d.* 样本. 设 $p(x; \theta)$ 满足适当的正则条件, 则在 H_0 下,

$$2 \log \lambda(\tilde{X}) \xrightarrow{D} \chi^2(1), \quad n \rightarrow \infty.$$

证明的大致思路: 将对数似然函数 $l(\theta; \tilde{X}) = \log L(\theta; \tilde{X})$ (其中 $L(\theta; \tilde{x}) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$) 在 θ 的MLE $\hat{\theta}$ 处Taylor展开得

$$l(\theta; \tilde{X}) = l(\hat{\theta}; \tilde{X}) + l'(\hat{\theta}; \tilde{X})(\theta - \hat{\theta}) + \frac{1}{2}l''(\hat{\theta}; \tilde{X})(\theta - \hat{\theta})^2 + \dots$$

而

$$2 \log \lambda(\tilde{X}) = 2l(\hat{\theta}; \tilde{X}) - 2l(\theta_0; \tilde{X}),$$

将 $l(\theta_0; \tilde{X})$ 的展开式代入上式, 并注意到 $l'(\hat{\theta}; \tilde{X}) = 0$, 得

$$2 \log \lambda(\tilde{X}) \approx -l''(\hat{\theta}; \tilde{X})(\theta_0 - \hat{\theta})^2.$$

由于在 H_0 下, 当 $n \rightarrow \infty$,

$$\frac{1}{n}l''(\hat{\theta}; \tilde{X}) \approx \frac{1}{n}l''(\theta_0; \tilde{X}) \xrightarrow{P} -I(\theta_0)$$

且

$$\sqrt{n}(\theta_0 - \hat{\theta}) \xrightarrow{D} N(0, I^{-1}(\theta_0)).$$

所以

$$2\log \lambda(\tilde{X}) \xrightarrow{D} \chi^2(1), \quad n \rightarrow \infty.$$

Theorem

(*LRT*的渐近分布,复合原假设情形) 考察假设检验问题

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta \notin \Theta_0.$$

设 $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 是从总体 $p(x; \theta)$ 抽取的 *i.i.d.* 样本. 设 $p(x; \theta)$ 满足适当的正则条件. 则在 H_0 下,

$$2 \log \lambda(\tilde{X}) \xrightarrow{D} \chi^2(\nu), \quad n \rightarrow \infty$$

其中 χ^2 分布的自由度

ν = 参数空间 Θ 的自由参数的个数

– 用来表示 Θ_0 的自由参数的个数.

Bayesian Tests

考察假设检验问题

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

在求得 θ 的后验分布 $\pi(\theta|\tilde{x})$ 后, 计算 Θ_0 和 Θ_1 发生的概率

$$\alpha_0 = P(H_0 \text{ is true } |\tilde{x}) = P(\theta \in \Theta_0|\tilde{x}),$$

$$\alpha_1 = P(H_1 \text{ is true } |\tilde{x}) = P(\theta \in \Theta_1|\tilde{x}).$$

检验法则如下

$$\text{当 } \frac{\alpha_0}{\alpha_1} \geq 1 \text{ 时接受 } H_0, \text{ 否则拒绝 } H_0,$$

若 $\Theta_1 = \Theta_0^c$, 则拒绝域为

$$\left\{ \tilde{x} : P(\theta \in \Theta_0^c | \tilde{x}) > \frac{1}{2} \right\}.$$

如果希望保护原假设, 拒绝域有时也可定义为

$$\{ \tilde{x} : P(\theta \in \Theta_0^c | \tilde{x}) > 1 - \alpha \}.$$